

CEI 60749-1  
(Première édition – 2002)

**DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS –  
MÉTHODES D'ESSAIS MÉCANIQUES  
ET CLIMATIQUES –**

**Partie 1: Généralités**

IEC 60749-1  
(First edition – 2002)

**SEMICONDUCTOR DEVICES –  
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS –**

**Part 1: General**

## **CORRIGENDUM 1**

Page 6

*Au lieu de:*

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2012.

*lire:*

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007.

Page 7

*Instead of:*

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2012.

*read:*

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2007.

*iTeh Standards  
(<https://standards.iteh.ai/>)  
Document Preview*

[IEC 60749-1:2002/COR1:2003](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/6fcfee4c-8fb3-4b75-ad61-345f39b63fed/iec-60749-1-2002-cor1-2003)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/6fcfee4c-8fb3-4b75-ad61-345f39b63fed/iec-60749-1-2002-cor1-2003>